

CEI 60269-4  
(Troisième édition – 1986)  
Amendement 2 (2002)

**Fusibles basse tension –  
Partie 4: Prescriptions supplémentaires  
concernant les éléments de remplacement  
utilisés pour la protection des dispositifs  
à semi-conducteurs**

IEC 60269-4  
(Third edition – 1986)  
Amendment 2 (2002)

**Low-voltage fuses –  
Part 4: Supplementary requirements  
for fuse-links for the protection  
of semiconductor devices**

## CORRIGENDUM 1

Page 16

**Tableau XIIA – Valeurs pour les essais  
de vérification du pouvoir de coupure  
des fusibles pour courant alternatif**

Explication des symboles

*Au lieu de:*

$I_{2a}$  ..... Des temps inférieurs peuvent  
être choisis pour des applications  
spéciales.

*lire:*

$I_{2a}$  ..... Des temps inférieurs à 30 s  
peuvent être choisis pour des applications  
spéciales. Voir note de 7.4.

Page 18

**Tableau XIIB – Valeurs pour les essais  
de vérification du pouvoir de coupure  
des fusibles pour courant continu**

Constante de temps <sup>c</sup>

*Au lieu de:*

Lorsque le courant présumé d'essai est  
supérieur à 20 kA: 10 ms à 12 ms

*lire:*

Lorsque le courant présumé d'essai est  
supérieur à 20 kA: 10 ms à 15 ms

Page 17

**Table XIIA – Values for breaking-  
capacity tests on a.c. fuses**

Explanation of symbols

*Instead of:*

$I_{2a}$  ..... Shorter times may be chosen  
for special applications.

*read:*

$I_{2a}$  ..... Shorter times than 30 s may  
be chosen for special applications. See  
note of 7.4.

Page 19

**Table XIIB – Values for breaking-  
capacity tests on d.c. fuses**

Time constant <sup>c</sup>

*Instead of:*

Where prospective test current is greater  
than 20 kA: 10 ms to 12 ms

*read:*

Where prospective test current is greater  
than 20 kA: 10 ms to 15 ms